Влияние *у*-облучения на фотолюминесценцию кристаллов Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te, предварительно обработанных интенсивным излучением неодимового лазера

© К.Д. Глинчук, А.П. Медвидь*, А.М. Мычко*, Ю.Н. Насека, А.В. Прохорович, О.Н. Стрильчук

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины, 03028 Киев, Украина * Riga Technical University,

LV-1048 Riga, Latvia

(Получена 16 мая 2012 г. Принята к печати 31 мая 2012 г.)

Изучено влияние предварительной обработки кристаллов $Cd_{0.9}Zn_{0.1}$ Те мощным импульсным излучением неодимового лазера (мощность $\leq 1.8 \text{ MBt/cm}^2$, длина волны 532 нм) на индуцированную γ -облучением (доза 5 кГр) низкотемпературную (5 K) фотолюминесценцию. Полосы люминесценции обусловлены радиационностимулированными донорно-акцепторными парами, включающими мелкие нейтральные доноры и стимулированные γ -облучением нейтральные вакансии кадмия, переходом свободных электронов на нейтральные созданные радиацией вакансии кадмия и аннигиляцией связанных на последних экситонов. Показано, что в предварительно обработанных лазерным излучением кристаллах интенсивности γ -стимулированных полос люминесценции слущественно ниже, чем в не обработанных лазерным излучением. Этот факт объясняется понижением концентрации созданных γ -облучением вакансий кадмия вследствие их аннигиляции при взаимодействии с лазерно-стимулированными дефектами, в частности вследствии их рекомбинации на лазерно-стимулированных межузельных атомах кадмия.

1. Введение

В последние годы значительное внимание уделяется изучению влияния у-облучения на фотолюминесценцию интерметаллических соединений, в частности кристаллов CdTe (см., например, [1]) и Cd_{1-x}Zn_xTe (см., например, [2]). Настоящая работа также посвящена изучению влияния у-облучения на фотолюминесценцию кристаллов $Cd_{1-x}Zn_xTe$, а именно выяснению влияния предварительной обработки кристаллов Cd_{1-x}Zn_xTe мощным лазерным облучением (использовалась вторая гармоника неодимового лазера) на их у-стимулированную фотолюминесценцию. Мы впервые покажем, что указанное воздействие существенно понижает интенсивности генерируемых в них у-индуцированных полос фотолюминесценции (обусловленных рекомбинацией в донорно-акцепторных парах (мелкий нейтральный донор $D^0\rangle - \langle$ радиацационно-стимулированная нейтральная вакансия кадмия $V_{\rm Cd}^0$, переходом свободных электронов на такие вакансии и аннигиляцией экситонов, связанных на вакансиях кадмия), и обсудим модель, объясняющую наблюдаемые закономерности.

2. Методика

Исследования проводились на кристаллах $Cd_{1-x}Zn_x$ Те (x = 0.1, величина x определялась методом рентгеновской дифрактометрии), выращенных методом Бриджмена под высоким давлением инертных газов. Удельное сопротивление при комнатной температуре составляло $\rho \approx 10^{10}$ Ом · см и $\rho \to \infty$ при температуре T = 5 К. Кристаллы предварительно шлифовались алмазными пастами и полировались в травителе бром-метанол [3] (в [3] показано, что обработка кристаллов CdTe в травителе бром-метанол существенно понижает, до минимальных значений, скорость поверхностной рекомбинации избыточных носителей тока в них). Изучалась фотолюминесценция следующих кристаллов Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te: а) исходных; б) облученных при 300 К у-квантами (доза $\Phi_{\gamma} = 5 \kappa \Gamma p$, энергия 1.2 МэВ, поток γ -квантов $8.45 \cdot 10^{14} \,\mathrm{cm}^{-2}$; далее — γ -облученные кристаллы); в) облученных второй гармоникой мощного наносекундного неодимового лазера YAG : Nd (длина волны 532 нм, энергия кванта 2.3 эВ, мощность $P_l \le 1.8 \text{ MBt/cm}^2$, длительность импульса 10 нс, коэффициент поглощения лазерного излучения 10⁵ см⁻¹; далее — лазернообработанные кристаллы); г) предварительно обработанных излучением второй гармоники лазера YAG : Nd, а затем облученных γ -квантами (доза $\Phi_{\gamma} = 5 \, \kappa \Gamma p$, далее — лазерно-радиационно-обработанные кристаллы). Все кристаллы изучались с помощью атомно-силовой микроскопии, и в результате можно утверждать, что лазерная обработка не приводит к изменениям поверхности указанных кристаллов. С целью избежать испарения атомов Cd и Te с поверхности изучаемых кристаллов под действием мощного излучения YAG : Nd-лазера (возможного вследствие нагрева излучением) на них была нанесена тонкая пленка SiO₂ (толщиной ~ 0.2 мкм), которая является прозрачной для излучения с энергиями фотонов $hv \le 2.3$ эВ [4]. Спектры фотолюминесценции исследуемых кристаллов Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te регистрировались при температуре $T = 5 \,\text{K}$. Для их регистрации использовался спектрометр МДР-23 и охлаждаемый фотоумножитель ФЭУ-62 (спектральное разрешение 0.2 мэВ). Для возбуждения люминесценции использовалось сильно поглощаемое (коэффициент поглощения 10⁵ см⁻¹) излуче-

[¶] E-mail: strilchuk@isp.kiev.ua

ние твердотельного полупроводникового лазера (мощность излучения 50 мВт, размер светового пятна 1 мм, энергия фотона 2.3 эВ). При указанной температуре измерения спектров фотолюминесценции проводимость исследуемых кристаллов определялась генерируемыми излучением твердотельного лазера фотоэлектронами и фотодырками. При используемых низких потоках γ -квантов при облучении кристаллов Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te радиационное воздействие не приводило к изменению (ослаблению либо усилению) темпа безызлучательной рекомбинации носителей тока в них [2].

3. Результаты

Основные данные, иллюстрирующие влияние предварительной обработки кристаллов $Cd_{0.9}Zn_{0.1}$ Те излучением YAG : Nd-лазера ($P_l \leq 1.8$ MBт/cm²) на индуцированную в них γ -облучением ($\Phi_{\gamma} = 5$ кГр) низкотемпературную (T = 5 K) фотолюминесценцию (на интенсивности полос излучения в спектрах люминесценции I, энергии максимумов hv_m и ширины на полувысоте w), показаны на рис. 1–4. В них обращают на себя внимание следующие закономерности, показывающие влияние лазерных, радиационных и лазерно-радиационных воздействий на фотолюминесценцию кристаллов $Cd_{0.9}Zn_{0.1}$ Те (величины I, hv_m и w).

1) В исходных кристаллах наблюдаются (см. рис. 1): а) относительно широкая сложная (неэлементарная) полоса люминесценции $D^0V_{\rm Cd}^0 + eV_{\rm Cd}^0$ с максимумом при $hv_m = 1.6012$ эВ и шириной на половине высоты w = 17 мэВ (она обусловлена, во-первых, излучательной рекомбинацией электронов на ростовых донорноакцепторных парах $D^0 V_{Cd}^0$, где D^0 — ростовой мел-кий нейтральный донор, V_{Cd}^0 — ростовая нейтральная вакансия кадмия, и, во-вторых, переходами свободных электронов е на мелкие нейтральные ростовые вакансии кадмия V_{Cd}^0) [1,2,5];¹ б) элементарная относительно узкая полоса люминесценции $V_{Cd}^0 X$ с $hv_m = 1.6454$ эВ и w = 5.5 мэВ, обусловленная излучательной аннигиляцией экситонов Х, связанных на нейтральных ростовых вакансиях кадмия V_{Cd}^0 , т.е. обусловленная связанными экситонами $V_{Cd}^0 X$ [1,2,5,6]. При указанной идентификации полос люминесценции в исходных кристаллах Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te учтено, что доминирующими мелкими акцепторами в них являются ростовые вакансии кадмия; изолированные и связанные в комплексы ростовые вакансии кадмия являются эффективными центрами люминесценции (см., например, [3] относительно CdTe, [7] относительно Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te).

2) Лазерное облучение кристаллов $Cd_{0.9}Zn_{0.1}$ Те приводит к относительно небольшому увеличению интенсивностей наблюдаемых в исходных кристаллах сложной, $D^0V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ с $hv_m = 1.6012$ эВ, и элементарной, V_{Cd}^0X с $hv_m = 1.6454$ эВ, полос люминесценции — эффект тем сильнее, чем выше P_l (см. рис. 1 и 2). Увеличение интенсивностей полос люминесценции, очевидно, связано с генерацией при лазерной обработке вакансий кадмия V_{Cd}^0 и в результате — с появлением лазерностимулированных центров люминесценции $D^0V_{Cd}^0$, V_{Cd}^0 и V_{Cd}^0X , рекомбинация носителей заряда через которые приводит к появлению лазерно-индуцированных сложных полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ и V_{Cd}^0X .



Рис. 1. Спектры фотолюминесценции при T = 5 К кристаллов Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te. a — исходный (1) и γ -облученный (1') кристаллы; b-d — лазерно-обработанные (2-4) и лазерно-радиационно-обработанные (2'-4') кристаллы. Доза γ -квантов $\Phi_{\gamma} = 5$ кГр, мощность лазерного облучения $P_l = 0$ (1, 1'), 0.48 (2, 2'), 1.2 (3, 3'), 1.8 MBT/cm² (4, 4'). p — LO-фононные повторения полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ и $V_{Cd}^0 X$. Спектры показывают истинные соотношения между интенсивностями излучаемых полос люминесценции в различных кристаллах.

¹ При низких температурах ($T = 5 \,\mathrm{K}$) в освещенных лазером кристаллах Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te вакансии Cd находятся в основном в нейтральном состоянии [2].



Рис. 2. *а*, *b* — зависимости интенсивностей *I* сложных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0 + e V_{Cd}^0$ (1, 1') и $V_{Cd}^0 X$ (2, 2') в лазерно-(1, 2) и лазерно-радиационно-обработанных (1', 2') кристаллах, а также интенсивностей элементарных радиационностимулированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$ (3), eV_{Cd}^0 (4) и V_{Cd}⁰X (5) в лазерно-радиационно-обработанных кристаллах $Cd_{0.9}Zn_{0.1}$ Te от дозы лазерного облучения P_1 . 1-5, 1', 2' показывают истинные соотношения между интенсивностями различных полос люминесценции; величины I при $P_l = 0$ характеризуют интенсивности полос в исходных (1, 2) и уоблученных без лазерной обработки (1', 2', 3-5) кристаллах. c — нормированные на значение I при $P_l = 0$ зависимости интенсивностей элементарных радиационно-стимулированных полос люминесценции $\hat{D}^0 V_{Cd}^0$ (6), eV_{Cd}^0 (7) и $\hat{V}_{Cd}^0 X$ (8) от дозы лазерного воздействия P₁ в лазерно-радиационнообработанных кристаллах. Доза радиационного воздействия $\Phi_{\gamma} = 5 \, \kappa \Gamma p$, температура измерений $T = 5 \, \mathrm{K}$.

3) Облучение γ -квантами кристаллов $Cd_{0.9}Zn_{0.1}$ Те приводит к появлению индуцированных радиационностимулированными вакансиями кадмия V_{Cd}^0 интенсивных сложных полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ $(hv_m = 1.6045$ эВ, w = 17 мэВ) и V_{Cd}^0X $(hv_m = 1.6461$ эВ, w = 5 мэВ) — см. рис. 1 [2]. Это связано с генерацией при γ -воздействии интенсивных радиационно-стимулированных полос люминесценции, а именно: сложной (неэлементарной) полосы люминесценции $D^0V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ с $hv_m = 1.6045$ эВ, w = 16 мэВ (см. рис. 3), обусловленной элементарными полосами люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$ и eV_{Cd}^0 , возникающими, во-первых, при рекомбинации электронов на радиационно-индуцированных донорноакцепторных парах $D^0 V_{Cd}^0$ ($hv_m = 1.598$ эВ, w = 9.3 мэВ, см. рис. 3 и 4) и, во-вторых, при переходах свободных электронов на нейтральные радиационно-стимулированные вакансии кадмия V_{Cd}^0 ($hv_m = 1.606$ эВ,



Рис. 3. Примеры разложения наблюдаемых при T = 5 К в кристаллах $Cd_{0.9}Zn_{0.1}$ Те радиационно-стимулированных сложных полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ на элементарные составляющие гауссовой формы $D^0V_{Cd}^0$ и eV_{Cd}^0 . Величины *I*, hv_m и w для элементарных полос (параметры разложения) приведены на рис. 2 и 4. Точки — сумма найденных элементарных радиационно-стимулированных полос $D^0V_{Cd}^0$ и eV_{Cd}^0 . a — облученный кристалл; b-d — лазерно-радицационно-обработанные кристаллы. Доза γ -квантов $\Phi_{\gamma} = 5$ кГр, мощность лазерного облучения $P_l = 0$ (*a*), 0.48 (*b*), 1.2 (*c*), 1.8 MBT/см² (*d*). Спектры показывают истинные соотношения между интенсивностями излучаемых полос люминесценции в различных кристаллах.



Рис. 4. Положения максимумов hv_m (1–3) и ширины на полувысоте w (1'–3') элементарных радиационно-стимулированных полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0$ (1, 1'), eV_{Cd}^0 (2, 2') и V_{Cd}^0X (3, 3') в лазерно-радиационно-обработанных кристаллах $Cd_{0.9}Zn_{0.1}$ Те при различных дозах лазерного облучения. Значения hv_m и w при $P_l = 0$ соответствуют γ -облученным кристаллам без лазерной обработки. Доза γ -облучения $\Phi_{\gamma} = 5$ кГр, температура измерения T = 5 К.

w = 10.8 мэВ — см. рис. 3 и 4 [2]);² элементарной полосы люминесценции $V_{Cd}^0 X$ с $hv_m = 1.6461$ эВ, w = 4.8 мэВ, обусловленной аннигиляцией экситонов X, связанных на нейтральных радиационностимулированных вакансиях кадмия, т.е. обусловленной связанными экситонами $V_{Cd}^0 X$ (см. рис. 4)³ (очевидно, что, во-первых, радиационно-стимулированные пары $D^0 V_{Cd}^0$ образуются за счет миграции подвижных при умеренных температурах вакансий кадмия, созданных γ -облучением, к дефектам D^0 и, во-вторых, возможно, радиационно-стимулированные связанные экситоны $V_{Cd}^0 X$ образуются за счет низкотемпературной миграции свободных экситонов к созданным γ -облучением вакансиям кадмия).

4) В у-облученных предварительно лазерно-обработанных кристаллах интенсивности генерируемых сложных радиационно-стимулированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0 + e V_{Cd}^0$ и $V_{Cd}^0 X$ существенно ниже интенсивностей аналогичных сложных полос, наблюдаемых в *у*-облученных, но не обработанных лазером $(P_{l} = 0)$ кристаллах (см. рис. 1). Указанный лазерностимулированный эффект снижения интенсивностей сложных полос люминесценции в лазерно-радиационно-обработанных кристаллах имеет место вследствие лазерно-стимулированного снижения интенсивностей у-индуцированных сложной полосы люминесценции $D^0 V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ и элементарных полос люминесцен-ции $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$ (см. рис. 2 и 3). Отмеченный эффект лазерно-стимулированного понижения интенсивностей ү-индуцированных сложной полосы люминесценции $D^0 V_{Cd}^0 + e V_{Cd}^0$ и элементарных полос люминес-ценции $D^0 V_{Cd}^0$, $e V_{Cd}^0$ и $V_{Cd}^0 X$ в предварительно лазернообработанных кристаллах выражен тем сильнее, чем выше доза лазерного облучения P_l (см. рис. 2).⁴

Здесь необходимо заметить следующее, относящееся к обработке приведенных на рис. 1 экспериментальных данных $I = f(\Phi_{\gamma}, P_l)$.

— На опыте наблюдалось определенное наложение исходных, γ -, лазерно-стимулированных и генерируемых в лазерно-радиационно-обработанных кристаллах полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и V_{Cd}^0X вследствие того, что в их формировании принимают участие центры люминесценции, приводящие к близким величинам hv_m и w — см. выше, а именно: исходных и γ -стимулированных в γ -облученных кристаллах; исходных и лазерно-стимулированных в лазерно-обработанных кристаллах; лазерно-стимулированных в лазерно-обработанных кристаллах; лазерно-стимулированных и наблюдаемых в лазернорадиационно-обработанных кристаллах (см. рис. 1). Результатом является тот факт, что измеряемые в радиационно- и лазерно-радиационно-обработанных кристаллах Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te интенсивности сложных полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ и V_{Cd}^0X несколько превышали

² Весьма вероятно, что радиационно-стимулированные центры люминесценции V_{Cd}^0 характеризуются сильным электрон-фононным взаимодействием (при переходе испускаются акустические фононы). Это приводит к существенному уширению (по сравнению с ожидаемым при отсутствии указанного взаимодействия ~ 0.75 мэВ при T = 5 К, т.е. для бесфононных излучательных переходов) элементарной радиационно-стимулированной полосы eV_{Cd}^0 , и обусловливает ее гауссову форму (см. рис. 3) [2].

³ О методе определения интенсивностей, положения максимума и ширины радиационно-стимулированных сложной, $D^0 V_{Cd}^0 + e V_{Cd}^0$, и элементарных, $D^0 V_{Cd}^0$, $e V_{Cd}^0$ и $V_{Cd}^0 X$, полос люминесценции из анализа сложных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0 + e V_{Cd}^0$ и $V_{Cd}^0 X$ в радиационно-, а также в лазерно-радиационно-обработанных кристаллах см. далее.

⁴ Лазерное воздействие не приводило к изменению положения максимумов и ширин радиационно-стимулированных элементарных полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и V_{Cd}^0X (см. рис. 4). Это свидетельствует о том, что лазерная обработка не приводит к изменению природы рассматриваемых радиационно-стимулированных центров люминесценции, а также состава кристаллов $Cd_{0.9}Zn_{0.1}$ Te [8].

интенсивности радиационно-индуцируемых в них сложнителениюсти радиациение иму $-r_{Cd}$ полос люми-несценции. Поэтому приведенные выше интенсивности γ -индуцированных сложной $D^0V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ и элементарной V_{Cd}⁰X полос люминесценции в не обработанных лазером кристаллах находились путем вычитания из спектров люминесценции у-облученных кристаллов соответствующих спектров люминесценции исходных (при $P_l = 0$) кристаллов, а радиационно-стимулированных сложной $D^0 V^0_{\mathrm{Cd}} + e V^0_{\mathrm{Cd}}$ и элементарной $V^0_{\mathrm{Cd}} X$ полос люминесценции в предварительно обработанных лазером кристаллах — путем вычитания из спектров люминесценции лазерно-радиационных кристаллов спектров люминесценции лазерно-обработанных кристаллов. Очевидно, при указанном методе определения интенсивностей радиационно-стимулированных полос люминесценции $D^0V^0_{Cd} + eV^0_{Cd}$ и $V^0_{Cd}X$ предполагается, что у-облучение слабо влияет на интенсивность лазерностимулированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{\rm Cd}^{0}X$; выполнение этого предположения не является принципиальным — его нарушение лишь несколько завышает рассчитанный лазерно-стимулированный эффект снижения интенсивностей элементарных радиационностимулированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{\rm Cd}^0 X$ (см. далее).

— Радиационно-стимулированные элементарные полосы люминесценции гауссовой формы $D^0V_{Cd}^0$ и eV_{Cd}^0 в γ и лазерно-радиационно-обработанных кристаллах находились путем разложения наблюдаемых в них γ -индуцированных сложных полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ на их элементарные составляющие $D^0V_{Cd}^0$ и eV_{Cd}^0 (см. рис. 3) [2]. Анализ найденных указанных элементарных полос люминесценции позволил определить зависимости их характеристик *I*, hv_m и *w* от дозы лазерного облучения P_l .

4. Обсуждение результатов

В принципе лазерно-стимулированный эффект понижения интенсивностей радиационно-стимулированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$ в предварительно лазерно-обработанных кристаллах Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te может быть связан со следующими двумя причинами: во-первых, со стоком радиационно-стимулированных вакансий кадмия на лазено-стимулированные дефекты, что приводит к снижению концентрации радиационностимулированных центров $D^0 V_{Cd}^0$, V_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$ и, следовательно, интенсивностей радиационно-стимулированных полос люминесценции $D^0V_{\rm Cd}$, $eV_{\rm Cd}^0$ и $V_{\rm Cd}^0X$ (очевидно, лазерно-стимулированный эффект снижения интенсивности рассматриваемых полос люминесценции будет тем выше, чем больше доза лазерного облучения); во-вторых, с генерацией лазерным облучением эффективных центров безызлучательной рекомбинации носителей тока, существенно понижающих концентрации последних и вследствие этого снижающих интенсивности радиационно-стимулированных полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и V_{Cd}^0X (несомненно, отмеченный лазерно-стимулированный эффект снижения интенсивности радиационно-стимулированных полос люминесценции будет тем больше, чем P_l выше).

Наблюдаемое нами лазерно-стимулированное снижение интенсивностей у-стимулированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$ связано со стоком индуцируемых у-облучением вакансий кадмия на лазерностимулированные дефекты, что приводит к существенному уменьшению концентрации центров люминесценции $D^{0}V_{Cd}^{0}, V_{Cd}^{0}$ и $V_{Cd}^{0}X$ (подробнее об этом см. далее). Маловероятным объяснением наблюдаемых закономерностей значительного уменьшения интенсивностей у-индуцированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$ при предварительном лазерном воздействии является усиливающаяся с ростом P_l генерация эффективных центров безызлучательной рекомбинации избыточных носителей тока (мы считаем, что возможный процесс лазерноиндуцированного усиления темпа безызлучательной рекомбинации носителей тока не оказывает существенного влияния на наблюдаемое снижение интенсивности радиационно-стимулированных полос люминесценции с ростом P₁). Действительно, о достоверности предположения, что обсуждаемое лазерно-индуцированное понижение интенсивностей ү-стимулированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$ обусловлено уменьшением концентраций ү-стимулированных центров люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, V_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$, свидетельствует следующее.

Интенсивности γ -стимулированных элементарных по-лос люминесценции $D^0V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и V_{Cd}^0X одинаково снижаются с ростом P₁ (см. рис. 2). Об этом свидетельствует наблюдаемое в лазерно-радиационно-обработанных кристаллах совпадение нормированных на значение *I* при $P_l = 0, I(0),$ зависимостей интенсивностей у-стимулированных элементарных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$ от P_l (см. рис. 2). Этого эффекта и следовало ожидать для случая, когда вызванное лазерной обработкой изменение интенсивностей полос люминесценции $D^0V^0_{Cd}$, eV^0_{Cd} и $V^0_{Cd}X$ обусловлено лазерно-стимулированным снижением концентрации центров $D^0 V_{Cd}^0$, V_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$. Действительно, в противном случае (когда изменение интенсивности радиационностимулированных полос люминесценции при предварительном лазерном облучении кристаллов обусловлено лазерно-индуцированным усилением темпа безызлучательной рекомбинации носителей тока) следовало ожидать существенного различия зависимостей интенсивностей полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0$ и eV_{Cd}^0 , с одной стороны, и V_{Cd}^0X — с другой, от дозы лазерного облучения P₁ ввиду сильно различающихся зависимостей интенсивностей полос $D^0 V_{\mathrm{Cd}}^0$ и eV_{Cd}^0 и полосы $V_{\mathrm{Cd}}^0 X$ от интенсивности возбуждения, т.е. от концентрации избыточных носителей тока [9].

Возможными процессами, приводящими к лазерностимулированному снижению интенсивностей *у*-индуцированных полос люминесценции, являются следующие: а) сток радиационно-стимулированных вакансий кадмия, в том числе появляющихся при термическом, при 300 K, распаде донорно-акцепторных пар $D^0 V_{Cd}^0$ и связанных экситонов $V_{Cd}^0 X$ на созданные лазерным облучением структурные дефекты, в частности межузельные атомы кадмия Cd_i; б) сток созданных лазерным воздействием межузельных атомов кадмия на у-стимулированные вакансии кадмия (в обоих случаях происходит процесс прямой рекомбинации у- и лазерностимулированных V_{Cd} и Cd_i).⁵ Указанным процессам способствует тот факт, что приповерхностная область лазерно-обработанных кристаллов (размером в несколько мкм) вследствие неравномерного нагрева кристаллов Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te мощным лазерным облучением и возникновением при этом термоупругих полей напряжений обогащена межузельными атомами кадмия и структурными дефектами [4]. Размеры приповерхностной области, в которой протекают лазерно-стимулированные процессы снижения интенсивности у-индуцированных полос люминесценции, как отмечалось, порядка нескольких мкм (это размер области, в которой эффективно поглощается излучение YAG : Nd-лазера). Очевидно, процессы, объясняющие лазерно-стимулированное снижение интенсивности γ -индуцированных полос $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$, происходят при повышенной температуре (в частности при 300 К), при которой вакансии и межузельные атомы кадмия достаточно подвижны.

Лазерно-стимулированная генерация полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0 + eV_{Cd}^0$ и V_{Cd}^0X и увеличение их интенсивностей при возрастании дозы лазерного облучения обусловлено тем, по-видимому, что в термоупругих полях, возникающих при лазерной обработке кристаллов $Cd_{0.9}Zn_{0.1}$ Те, происходит существенная генерация избыточных вакансий кадмия [4].

Заметим, что, вообще говоря, у-облучение рассматриваемых кристаллов может приводить к появлению интенсивных радиационно-стимулированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$, но и к понижению интенсивностей лазерно-стимулированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, $e^0 V_{Cd}^0$ и $V_{Cd}^0 X$. Отмеченный эффект может иметь место вследствие стока созданных лазерной обработкой вакансий кадмия на у-индуцированные дефекты, в частности межузельные атомы кадмия. Очевидно, указанный эффект (если он имеет место) вносит относительно небольшой вклад в вычисленные (см. выше) интенсивности у-индуцированных полос люминесценции $D^0 V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и $V_{Cd}^0 X$ и вид их зависимости от Р₁ (несколько завышается рассчитанный лазерностимулированный эффект снижения интенсивностей уиндуцированных полос люминесценции $D^0 V_{\rm Cd}^0$, $eV_{\rm Cd}^0$ и $V_{Cd}^{0}X$). Это следует из наблюдаемого на опыте при разных P_{l} существенного различия интенсивностей полос люминесценции $D^{0}V_{Cd}^{0} + eV_{Cd}^{0}$ и $V_{Cd}^{0}X$ в лазернои лазерно-радиационно-обработанных кристаллах — интенсивности указанных полос люминесценции во втором случае существенно выше, чем в первом (см. рис. 1 и 2).

5. Заключение

Предварительное облучение кристаллов $Cd_{1-x}Zn_x$ Те интенсивным излучением второй гармоники неодимового лазера приводит к существенному уменьшению интенсивностей генерируемых γ -облучением элементарных полос люминесценции $D^0V_{Cd}^0$, eV_{Cd}^0 и V_{Cd}^0X . Отмеченное имеет место вследствие аннигиляции созданных γ -облучением вакансий кадмия при их взаимодействии с лазерно-стимулированными дефектами, в частности с межузельными атомами кадмия. Полученные данные важны для понимания процессов радиационного дефектообразования (в частности процессов взаимодействия различных радиационных дефектов) в атомарных и интерметаллических полупроводниках [10,11].

Список литературы

- S.G. Krylyuk, D.V. Korbutyak, Yu.V. Kryuchenko, I.M. Kupchak, N.D. Vakhnyak. J. Alloys. Comp., 371, 142 (2004).
- [2] K.D. Glinchuk, N.M. Litovchenko, Yu.N. Naseka, A.V. Prohorovich, L.V. Rashkovetskyi, O.N. Strilchuk, F.F. Sizov, O.O. Voitsihovska, B.O. Danilchenko. Ukr. J. Phys., 55, 776 (2010).
- [3] Q. Li, W. Jie, Z. Gu, G. Yang, T. Wang, J. Zhang. J. Cryst. Growth, 265, 159 (2004).
- [4] A. Medvid', L. Fedorenko, B. Korbytjak, S. Kryluk, M. Yusupov, A. Mychko. Radiat. Meas., 42, 701 (2007).
- [5] K. Hjelt, M. Juvonen, T. Tuomi, S. Nenonen, E. Eissler, M. Bavdaz. Phys. Status Solidi A, 162, 747 (1997).
- [6] T.E. Schlesinger, J.E. Toney, H. Yoon, E.Y. Lee, B.A. Branett, R.B. James. Mater. Sci. Engin R, 32, 103 (2001).
- [7] Q. Li, W. Jie, L. Fu, G. Yang, G. Zha, T. Wang, D. Zeng. J. Appl. Phys., **100**, 013 518 (2006).
- [8] K.D. Glinchuk, N.M. Litovchenko, O.N. Strilchuk. Semicond. Phys., Quant. Electron. Optoelectron. 6, 121 (2003).
- [9] К.Д. Глинчук, Н.М. Литовченко, А.В. Прохорович, О.Н. Стрильчук. В сб.: Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Киев, Наук. думка, 2008) вып. 43, с. 44.
- [10] Л.С. Смирнов. Физические процессы в облученных полупроводниках (Наука, Сиб. отд-ние, Новосибирск, 1977).
- [11] В.В. Емцев, Т.В. Машовец. Примеси и точечные дефекты в полупроводниках (М., Радио и связь, 1981).

Редактор Л.В. Шаронова

⁵ Не исключено, что лазерно-индуцированное понижение интенсивности γ-стимулированных полос люминесценции связано не только с прямой рекомбинацией радиационно-стимулированных вакансий и лазерно-индуцированных межузельных атомов кадмия, но и со стоком указанных вакансий Cd в область сильных термоупругих напряжений, возникающих при мощном лазерном облучении кристаллов Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te [4].

Influence of γ -irradiation on the photoluminescence of Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te crystals preliminary treated by the invensive irradiation of the neodymium laser

K.D. Glinchuk, A.P. Mevid'*, A.M. Mychko*, Yu.M. Naseka, A.V. Prochorovich, O.N. Strilchuk

Lashkarev Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, 03028 Kyiv, Ukrane * Ruga Technical University, LV-1048 Riga, Latvia

Abstract Influence of the preliminary Nd-laser irradiation (power ≤ 1.8 MW/cm², wavelength 532 nm) of Cd_{0.9}Zn_{0.1}Te crystals on the γ -irradiation (dose 5 kGy) induced low-temperature (5 K) photoluminescence is considered. The emission bands are induced by the donor–acceptor pairs including shallow neutral donors and γ -radiation stimulated neutral cadmium vacancies, by transitions of free electrons to the radiation-induced neutral vacancies and by annihilation of excitons bound to the vacancies. It is shown that in the preliminary laser treated crystals the intensities of γ -induced emission bands are substatially lower than in the laser-untreated γ -irradiated crystals. The pointed regularity is explained by decrease in the concentrations of the γ -induced cadmium vacancies as a result of their annihilation when interacting with the laser stimulated defects, in particular, with their recombination on the laser-induced interstitial cadmium atoms.